

REC'D 1 6 FEB 2004

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ______ 2 5 NOV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

> INSTITUT National de La propriete

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopte : 33 (0)1 53 04 45 23



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTALITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



pro-	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 540 9 W / 010500
REMISE DES PIÈCES DE C 2002	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
ueu 75 INPI PARIS	
N° D'ENREGISTREMENT 0216712	CABINET PLASSERAUD
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	84 RUE D'AMSTERDAM 75009 PARIS
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 2 6 DEC. 21	005 1,500a LYVIQ
PAR L'INPI	
Vos références pour ce dossier (facultatif) AH/EMA-BFF020290	5
Confirmation d'un dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie
MATURE DE LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases sulvantes
Demande de brevet	K
Demande de certificat d'utilité	
Demande divisionnaire	
Demande de brevet initiale	No. Date
	N° Date
ou demande de certificat d'utilité initiale	
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale	N° Date LILI
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères cu	
I-III-VI2 EN COUCHES MINCES.	
DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Date N°
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation
DEMANDE ANTERIEURE FRANÇAISE	Date N°
	S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	
Nom	ELECTRICITE DE FRANCE, Service National
ou dénomination sociale	
Prénoms	Fig. 1: a constant individual at commercial
Forme Juridique	Etablissement Public à caractère industriel et commercial.
N° SIREN	
Code APE-NAF	22-30, avenue de Wagram
Domicile Rue	22-30, avenue de vvagram
ou Code postal et ville	[7,5,0,0,8] PARIS
siège Pays	FRANCE
Nationalité	FRANCAISE
N° de téléphone (facultatif)	N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)	
	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



BREVET D'INVESTION CERTIFICAT D'UTESTÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI				
REMISE DES PIÈCES	2002				
UEU 75 INPI P	ARIS				
	0216712				
N° D'ENREGISTREMENT		!		OB 540 G W / OICEOL	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'		<u> </u>			
Vos références po	eur ce dossier :	AH/EMA-BFF020	0290		
(facultatif)	real land of the Contraction of				
MANDATAIRE	(sil yā lieu)			(1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
Nom					
Prénom					
Cabinet ou So	ciété	CABINET PLAS	CABINET PLASSERAUD		
	permanent et/ou			i i	
de lien contra	ctuei				
	Rue	84 RUE D'AMS	TERDAM		
Adresse	O 1	17.5.0.0.010	ADIC		
	Code postal et ville	[7 5 0 0 9 P	MNIO		
NO 1 1515 1-	Pays	01 44 63 41 11			
N° de télépho		0144034111			
N° de télécop	ie (facultatif) ronique (facultatif)				
THE REPORT OF STREET	STORES TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	THE STATE OF THE STATE OF	sont nécessairement des p	ersonnes physiques	
INVENTEUR	4. 4. 2. St. 4. 4. 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Les inventeurs	sour liacessaitement nes h		
	urs et les inventeurs	Oui		to de Dácionalina alimentario	
1	es personnes	X Non: Dan	s ce cas remplir le formula	ire de Désignation d'inventeur(s)	
TAPPORT D	E RECHERCHE	Uniquement po	ur une demande de brevet	(y compris division et transformation)	
7.	Établissement immédia				
	ou établissement différ	é 🔲			
		Uniquement po	ur les personnes physiques e	ffectuant elles-mêmes leur propre dépôt	
Paiement éc	helonné de la redevance	1			
	(en deux versements)	Oui			
RÉDUCTION		Uniquement p	our les personnes physique		
DES REDEVANCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
		Obtenue an	térieurement à ce dépôt pour	cette invention (joindre une copie de la	
		décision d'admi	ssion à l'assistance gratuite ou i	ndiquer sa référence): AG	
	معاده و السومانية و المانية				
Si vous ave	ez utilisé l'imprimé «Suite» nombre de pages jointes	1 PAGE			
				VISA DE LA PRÉFECTURE	
10 SIGNATUR	E DU DEMANDEUR NDATAIRE	1-	Luce	OU DE L'INPI	
	NDAIAIKE ualité du signataire)	Xte	A		
	VERDURE (CPI n° 97-09	01)	フ	M ROCHET	
Stephane	VENDORE (OF THE OF OC				
		_	•	·	
			7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		



26 bls, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécople : 33 (1) 42 94 86 54

CERTIFICA D'UTILITÉ Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

requête en délivrance

Page suite N° 1../1...



	Réservé à l'INPI	1			
REMISE DES PIÈCES	2002		•		
UEU 75 INPI PA					
	0216712				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I	NPI	Cet imprir	né est à remplir lisiblement à l'encr	e noire 08 829 9 W / 180501	
	ur ce dossier (facultatif)	AH/EMA-BFF020290			
		Pays ou organisation			
DÉCLARATION		Date LILILI	N°]	
	DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation			
	DÉPÔT D'UNE	Date LILL	N°		
DEMANDE AN	TÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	No		
Complete Address Complete	A STATE OF THE STA	Date	: Personne physiq	ue a series de la companya de la com	
BEWANDEUR	(Cochez l'une des 2 casés)				
Nom	1 -1-	CENTRE NATIONAL DE I	A RECHERCHE SCIENTIFIC	TOE - CIVICO	
ou dénomination	on sociale				
Prénoms		Etablissement Public Scie	entifique et Technologique EP	ST	
Forme juridique	8	Etablissement Fublic, Oct	mindro or roomiciosides	į,	
N° SIREN Code APE-NAF		<u> </u>			
Code APE-INAP		3, RUE MICHEL ANGE			
Domicile	Rue ·	3, RUE MICHEL ANGL	·		
ou	Code postal et ville	[7 5 7 9 4] PARIS Cede	x 16		
siège	Pavs	FRANCE		Trick.	
Nationalité		FRANCAISE		8	
N° de télépho	ne (facultatif)			<u> </u>	
N° de télécopi					
Adresse électr	onique (facultatif)			entral of the decision of the section of	
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases	Personne morale	Pérsonne physic	ina the second second	
Nom				•	
ou dénominat	ion sociale				
Prénoms					
Forme juridique	ue				
N° SIREN		╽┞╍┶╼┷╍ ┼╾ ┩╸ ┸╾┷╼┶╼┼╾┤╌			
Code APE-NA	-	 	No.		
Domicile	Rue				
ou	Code postal et ville				
siège					
Nationalité	Pays				
	one (facultatif)	 			
N° de télécor					
	tronique (facultatif)				
	DU DEGGANDEND		VISA VISA	DE LA PRÉFECTURE	
OU DU MA	NID ATGINE	phane VERDURE	NISA VISA	OU DE L'INPI	
	alité du signataire)	I n° 97-0901)	S	2001 ICT	
			/ M. I	HOCHET	

Procédé de régénération d'un bain d'électrolyse pour la fabrication d'un composé I-III-VI2 en couches minces

La présente invention concerne la fabrication de semiconducteurs de type $I-III-VI_2$ en couches minces, notamment pour la conception de cellules solaires.

5

10

15

20

25

30

Les composés I-III-VI2 de type CuInxGa(1-x)SeyS(2-y) (où x est sensiblement compris entre 0 et 1 et y est sensiblement considérés comme et 2) sont entre 0 compris prochaine constituer 1a pourraient prometteurs et génération de cellules photovoltaïques en couches minces. Ces composés ont une largeur de bande interdite directe comprise entre 1,05 et 1,6 eV qui permet une absorption des radiations solaires dans le visible.

Les rendements records de conversion photovoltaïque ont couches minces par préparant des en obtenus été surfaces. petites de sur évaporation l'échelle adapter à difficile à est l'évaporation industrielle en raison de problèmes de non-uniformité et premières. matières utilisation des de faible pulvérisation cathodique (méthode dite de "sputtering") est mieux adaptée aux grandes surfaces mais elle nécessite des équipements sous vide et des cibles de précurseurs très coûteux.

Il existe donc un réel besoin pour des techniques alternatives à faible coût et à pression atmosphérique. La technique de dépôt de couches minces par électrochimie, en particulier par électrolyse, se présente comme une

alternative très séduisante. Les avantages de cette technique de dépôt sont nombreux et notamment les suivants:

- dépôt à température et pression ambiantes dans un bain d'électrolyse,
- possibilité de traiter de grandes surfaces avec une bonne uniformité,
- facilité de mise en œuvre,
- faible coût d'installation et des matières premières 10 (pas de mise en forme particulière, taux d'utilisation élevé des matières), et
 - grande variété des formes possibles de dépôt, due à la nature localisée du dépôt sur le substrat.
- Malgré de nombreuses recherches dans cette voie, les difficultés rencontrées ont porté sur le contrôle de la qualité des précurseurs électrodéposés (composition et morphologie) et sur l'efficacité du bain d'électrolyse après plusieurs dépôts successifs.

Un but de la présente invention est de proposer un procédé de fabrication de couches minces d'un composé I-III-VI_y (où y est voisin de 2) par électrolyse, qui assure la stabilisation et la reproductibilité des conditions de

25 dépôt.

Un but sous-jacent est de pouvoir effectuer sur de grandes surfaces un nombre important de dépôts successifs de couches minces ayant la morphologie et la composition souhaitées.

20

30

Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé de fabrication de couches minces du composé I-III-VI, qui assure une durée de vie satisfaisante du bain d'électrolyse, ainsi qu'une régénération efficace des matières premières consommées pendant l'électrolyse.

Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé de fabrication de couches minces du composé I-III-VI, qui assure une régénération des matières premières consommées pendant l'électrolyse, sans pour autant déséquilibrer la composition du bain d'électrolyse et réduire alors sa durée de vie.

Elle propose à cet effet un procédé de fabrication d'un composé I-III-VI_y en couches minces par électrochimie, où y est voisin de 2 et VI est un élément comprenant du sélénium, du type comprenant les étapes suivantes :

- a) prévoir un bain d'électrolyse comprenant du sélénium actif, de degré d'oxydation IV, ainsi qu'au moins deux électrodes, et
- b) appliquer une différence de potentiel entre les deux électrodes pour favoriser sensiblement une migration du sélénium actif vers l'une des électrodes et amorcer ainsi la formation d'au moins une couche mince de I-III-VI_y.

Le procédé au sens de l'invention comporte en outre une étape c) de régénération du sélénium sous forme active dans ledit bain, pour augmenter une durée de vie dudit

bain d'électrolyse.

25

5

10

15

Ainsi, au sens de la présente invention, on commence par régénérer le bain en sélénium actif avant de le régénérer en élément I (tel que le cuivre) et/ou en élément III (tel. que l'indium ou le gallium). En effet, il a été constaté qu'une faible ré-introduction de sélénium actif dans (préférentiellement, un excès d'environ quantité concentration molaire par rapport de à la d'obtenir normalement ajoutée) permettait sélénium nouveau sensiblement un même nombre et de mêmes volumes de couches minces que celles obtenues à l'issue de l'étape b).

Avantageusement, à l'issue de l'étape c), on forme au moins une nouvelle couche mince de I-III-VI_y.

15

5

10

Ainsi, dans une première réalisation, à l'étape c), on rajoute du sélénium dans le bain pour former un excès de sélénium actif dans le bain.

20

Dans une autre réalisation, variante ou complémentaire de la première réalisation précitée, à l'étape c), on introduit dans le bain un oxydant du sélénium, pour régénérer du sélénium sous forme active.

25

Habituellement, le bain d'électrolyse, lorsqu'il vieillit au cours du dépôt, présente des colloïdes de sélénium. Ce sélénium sous forme de colloïdes est de degré d'oxydation 0 et, dans le contexte de la présente invention, n'est pas susceptible de se combiner aux éléments I et III. Avantageusement, si le bain comprend du sélénium sous forme de colloïdes à l'étape b), l'oxydant précité est capable de régénérer le sélénium sous forme de colloïdes, en sélénium sous forme active.

5

10

Ainsi, on comprendra que l'on entend par "sélénium sous forme active" du sélénium au degré d'oxydation IV, susceptible d'être réduit à l'électrode sous forme ionique Se²⁻ et de se combiner naturellement aux éléments I et III pour former les couches minces de I-III-VI_y, et se distinguant du sélénium de degré d'oxydation 0, par exemple sous forme de colloïdes dans la solution du bain, qui ne se combine pas aux éléments I et III.

Dans une réalisation particulièrement avantageuse, ledit 15 préférence en de l'eau oxygénée, de est grandeur ordre de bain d'un concentration dans le cinq la à au moins sensiblement correspondant concentration initiale en sélénium dans le bain.

20

L'ajout d'eau oxygénée dans le bain permet alors de régénérer le bain d'électrolyse à très faible coût. De plus, cette régénération s'effectue sans pollution du bain puisqu'un simple dégazage permet de retrouver la constitution initiale du bain.

25

30

Dans cette optique où l'on régénère le bain d'électrolyse en limitant sa pollution par les additifs régénérant, on prévoit avantageusement une étape ultérieure à l'étape c), de régénération du bain d'électrolyse par introduction d'oxydes et/ou d'hydroxydes d'éléments I et III.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ciaprès de modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs, ainsi qu'à l'examen des dessins qui l'accompagnent et sur lesquels:

- la figure 1 représente schématiquement une couche mince obtenue par la mise en œuvre du procédé selon l'invention, et
- 10 la figure 2 représente schématiquement un bain d'électrolyse pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention.

référant à la figure 1, des couches diséléniure de cuivre et d'indium sont obtenues à pressioni. 15 et température ambiantes par électrodéposition d'une couche mince précurseurs de composition de morphologie adaptée, sur un substrat de verre S recouvert de molybdène MO. On entend par le terme "couche 20 une couche mince de composition globale précurseurs", voisine de CuInSe2 et directement obtenue après le dépôt par électrolyse, sans traitement ultérieur éventuel.

L'électrodéposition est effectuée à partir d'un bain acide B (figure 2), agité par des pales M, contenant un sel d'indium, un sel de cuivre et de l'oxyde de sélénium dissous. Les concentrations de ces éléments précurseurs sont comprises entre 10⁻⁴ et 10⁻² M. Le pH de la solution est fixé entre 1 et 4.

30

5

Trois électrodes An, Ca et REF, dont :

une électrode de molybdène Ca (pour cathode) sur laquelle se forme la couche mince par électrodéposition,
 et une électrode de référence au sulfate mercureux REF, sont immergées dans le bain B.

5

La différence de potentiel électrique appliquée à l'électrode de molybdène est comprise entre -0,8 et -1,2 V par rapport à l'électrode de référence REF.

Des couches d'épaisseur comprise entre 1 et 4 microns sont obtenues, avec des densités de courant comprises entre 0,5 et 10 mA/cm².

Dans des conditions définies de composition, d'agitation et de différence de potentiel, il est possible d'obtenir des couches denses, adhérentes, de morphologie homogène et dont la composition est proche de la composition stœchiométrique : Cu (25%), In (25+8%) et Se (50%), avec une composition légèrement plus riche en indium, comme le montre le tableau I ci-après. On peut ainsi réaliser des dépôts sur des surfaces de 10x10 cm².

On donne ci-après un exemple de réalisation de l'invention.

25

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain dont la formulation initiale est la suivante :

 $[CuSO_4] = 1, 0.10^{-3} M,$

 $[In_2(SO_4)_3] = 3,0.10^{-3} M,$

30 $[H_2SeO_3] = 1, 7.10^{-3} M,$ $[Na_2SO_4] = 0, 1 M,$ où la notation "M" correspond à l'unité "mole par litre", pour un pH de 2,2.

Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à .

5 potentiel imposé, à -1 V par rapport à l'électrode REF. La densité de courant est de -1 mA/cm².

Après chaque électrolyse, la recharge du bain en éléments Cu, In et Se est effectuée sur la base du nombre de coulombs indiqué par une cellule de détection (non représentée) qui compte ainsi le nombre d'ions ayant interagi dans la solution du bain. Cette recharge permet de garder constante la concentration des éléments au cours des électrodépôts successifs. Le pH peut également être réajusté par ajout de soude (telle que NaOH, pour une concentration telle que 1M) mais cette mesure n'est pas systématiquement nécessaire ici, comme on le verra plus loin.

Dans ces conditions, on constate habituellement qu'après une indication de 500±100 Coulombs dans une solution d'un litre (correspondant à l'électrodépôt de 4 à 5 couches minces de 25 cm² ayant une épaisseur de 2 μm), un décollement partiel ou total des couches de CuInSe₂ apparaît systématiquement.

Selon l'invention, ce décollement disparaît par régénération du bain en sélénium, avant même de régénérer les éléments Cu et In.

10

5

10

15

20

Il convient ici de distinguer le sélénium actif de degré d'oxydation IV, noté habituellement Se(IV), du sélénium inactif, de degré d'oxydation 0, que l'on observe généralement sous la forme de colloides dans le bain d'électrolyse et noté habituellement Se(0).

On indique que le sélénium actif Se(IV) est seul susceptible d'être réduit à l'électrode Ca sous la forme ionique Se²⁻ et de se combiner, sous cette forme, aux éléments Cu et In pour former les couches minces de CuInSe₂.

On indique aussi qu'il existe deux réactions compétitives pendant l'électrolyse : le sélénium introduit dans le bain peut se transformer à l'électrode :

- soit en Se²⁻ favorable à la formation des couches minces comme indiqué ci-avant,
- soit en Se(0) sous forme de colloïdes, ce qui est défavorable à la formation des couches minces, notamment parce que les colloïdes posent des problèmes à l'interface entre le substrat (ou la couche MO de molybdène ici) et la couche mince de Cu-In-Se en formation.

Avantageusement, on effectue une régénération en excès de Se(IV) dans le bain. A cet effet, on ajoute de l'oxyde de sélénium dissous dans le bain d'électrolyse pour retarder le vieillissement du bain. En pratique, pour une couche mince formée et 115 Coulombs passés dans la solution, il faut théoriquement ajouter 1,8.10⁻⁴ M de [H₂SeO₃] à la solution pour retrouver une concentration initiale en sélénium de 1,7.10⁻³ M. Un ajout du double de cette

quantité (soit 3,6.10⁻⁴ M et donc un excès de 1,8.10⁻⁴ M de [H₂SeO₃]), au cinquième dépôt, permet d'obtenir à nouveau des couches adhérentes. Ces couches minces ont la composition (tableau I) et la morphologie souhaitée. Une surrégénération de 3,6.10⁻⁴ M permet ainsi d'obtenir un cycle de 4 à 5 couches d'adhérence satisfaisante avant d'observer de nouveaux problèmes de décollement. Après chaque cycle de décollement, le renouvellement de cette opération permet d'obtenir des couches adhérentes.

10

15

5

En variante ou en complément de cette opération, utilise un oxydant permettant de ré-oxyder le sélénium sous la forme Se(0), pour obtenir du sélénium sous forme Se(IV). A cet effet, on utilise préférentiellement de l'eau oxygénée H₂O₂, en mettant en large excès H₂O₂ dans (concentration de l'ordre de 10^{-2} M, solution la préférentiellement voisine de 4.10⁻² M). Les redeviennent adhérentes pour 4 à 5 dépôts successifs de décollent nouveau. Le se à minces, puis couches renouvellement de cette opération permet aussi d'obtenir à nouveau des couches adhérentes. Avantageusement, on a que l'ajout d'eau oxygénée permet d'obtenir des couches minces de morphologie relativement plus lisse.

25

30

20

On remarque ainsi une grande similitude des effets que procurent une surrégénération en Se(IV) et l'ajout de H_2O_2 dans la solution. On indique en outre que d'autres types d'oxydant que l'eau oxygénée, notamment de l'ozone O_3 , peuvent être utilisés pour augmenter la durée de vie des bains.

La composition (tableau I) et la morphologie des couches est sensiblement la même, que l'on ait rajouté de l'eau oxygénée dans le bain ou que l'on ait effectué une régénération de sélénium (IV).

5

10

15

20

25

Tableau I : Analyse comparative de la composition des couches minces de CuInSe₂ électrodéposées en fonction d'une surrégénération en excès de sélénium Se(IV) et d'un ajout d'eau oxygénée.

	Cu (%)	In (%)	Se (%)
Premier dépôt	21,4	27,5	51
Ajout d'H ₂ O ₂	22,9	25	52
Régénération en excès de Se(IV)	21,4	28,8	49,7

L'ajout d'eau oxygénée ou la régénération en excès Se(IV) permettent d'accroître considérablement le nombre de couches pouvant être déposées avec un bain. Un tel recyclage du bain permet de consommer intégralement, par introduits, éléments électrolyse, les. particulièrement l'indium, ce qui permet de réduire de de coûts les avantageuse particulièrement fabrication des précurseurs, notamment par rapport aux méthodes d'évaporation ou de sputtering.

On indique que, selon aspect avantageux de la régénération du bain au sens de l'invention, on ajoute en outre des oxydes ou des hydroxydes de cuivre et/ou d'indium pour

régénérer le bain d'électrolyse de CuInSe₂ en cuivre et/ou en indium.

Par exemple, en ajoutant dans le bain les oxydes de cuivre CuO et d'indium In_2O_3 , on forme les réactions (1) et (2) suivantes :

$$CuO + H_2O \rightarrow Cu^{2+} + 2OH^-$$
 (1)

$$(1/2) \operatorname{In}_2 O_3 + (3/2) \operatorname{H}_2 O \to \operatorname{In}^{3+} + 3OH^{-}$$
 (2)

10 En revanche, s'il était ajouté les composés $CuSO_4$ et $In_2(SO_4)_3$, le bain serait pollué en ions sulfate $SO_4^{2^-}$.

En outre, la réaction de formation du CuInSe₂ à la cathode s'écrit :

15 Cu²⁺ + In³⁺ + 2H₂SeO₃ + 8H⁺ + 13e⁻→ CuInSe₂ + 6H₂O (3)

où e⁻ correspond à la notation d'un électron, tandis qu'à
l'anode, on a la réaction suivante :

$$(13/2)$$
 H₂O \rightarrow 13H⁺ + (13/4) O₂ + 13e⁻ (4)
pour respecter l'équilibre des charges.

20

25

On constate alors, selon un autre avantage que procure l'ajout d'oxydes de Cu et In, que l'écart de cinq ions H' équations (3) est excédentaires d'après les OHintroduits cinq ions compensé par les réactions (1) et (2). On comprendra ainsi que l'ajout d'oxydes de Cu et In permet en outre de stabiliser le pH de la solution et de se passer de l'ajout de soude comme indiqué ci-avant.

On indique en outre que l'ajout d'hydroxydes $Cu(OH)_2$ et $In(OH)_3$ produit les mêmes effets, les réactions (1) et (2) devenant simplement :

$$Cu(OH)_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2OH^{-}$$
 (1')

(21) $In(OH)_3 \rightarrow In^{3+} + 3OH^{-}$ 5 On assure ainsi une durabilité et une stabilité des bains I-III-VI_v tels d'électrodéposition de composés Cu-In-Sey (avec y voisin de 2) par ajout d'agents qui n'affectent pas la qualité des couches. La couche de éléments électrodéposés les contient 10 précurseurs la stœchiométrie I-III-VI₂. composition proche de compositions et la morphologie sont contrôlées lors de (excès de Se(IV) Ces agents l'électrolyse. peuvent aisément être utilisés pour tout type de bain d'électrolyse permettant l'électrodéposition de systèmes 15 I-III-VI tels que Cu-In-Ga-Al-Se-S.

Les rendements de conversion obtenus (9% sans couche superficielle d'anti-reflet) attestent de la qualité des dépôts obtenus par le procédé selon l'invention.

Bien entendu, la présente invention ne se limite pas à la forme de réalisation décrite ci-avant à titre d'exemple ; elle s'étend à d'autres variantes.

25

30

20

Ainsi, on comprendra que les éléments I et III initialement introduits dans la solution sous la forme CuSO_4 et $\text{In}_2(\text{SO}_4)_3$ peuvent avantageusement être introduits plutôt sous la forme d'oxydes ou d'hydroxydes de cuivre et d'indium pour limiter la pollution du bain.

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de fabrication d'un composé I-III-VI_y en couches minces par électrochimie, où y est voisin de 2 et VI est un élément comprenant du sélénium, du type comprenant les étapes suivantes :
- a) prévoir un bain d'électrolyse comprenant du sélénium actif, de degré d'oxydation IV, ainsi qu'au moins deux électrodes, et
- b) appliquer une différence de potentiel entre les deux électrodes pour favoriser sensiblement une migration du sélénium actif vers l'une des électrodes et amorcer ainsi la formation d'au moins une couche mince de I-III-VIy;
- caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape 15 c) de régénération du sélénium sous forme active dans ledit bain, pour augmenter une durée de vie dudit bain d'électrolyse.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
 que, à l'étape c), on introduit dans le bain un oxydant du sélénium (Se(0)), pour régénérer du sélénium sous forme active (Se(IV)).
- 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que, le bain comprenant du sélénium (Se(0)) sous forme de colloïdes à l'étape b), ledit oxydant est agencé pour régénérer le sélénium (Se(0)) sous forme de colloïdes, en sélénium (Se(IV)) sous forme active.

- 4. Procédé selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que ledit oxydant est de l'eau oxygénée (H_2O_2) .
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la concentration en eau oxygénée ajoutée dans le bain est d'un ordre de grandeur correspondant sensiblement à au moins cinq fois la concentration initiale en sélénium dans le bain.

10

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, à l'étape c), on rajoute du sélénium dans le bain pour former un excès de sélénium actif dans le bain.

15

20

25

- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, pour sensiblement un dixième de la concentration de sélénium à l'étape a) consommée par fabrication d'au moins une couche mince à l'étape b), on ajoute dans le bain, à l'étape c), sensiblement le double de la concentration consommée.
- 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, à l'issue de l'étape c), on forme au moins une nouvelle couche mince de I-III-VI_y.
- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour la fabrication de couches minces de CuInSey, le bain comprend à l'étape a), pour une unité de concentration de cuivre dans le bain, environ 1,7 unités de concentration de sélénium actif.

10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une étape ultérieure à l'étape c), de régénération du bain d'électrolyse par introduction d'oxydes et/ou d'hydroxydes d'éléments I (CuO; Cu(OH) $_2$) et III (In $_2$ O $_3$; In(OH) $_3$).



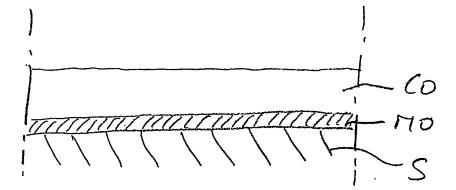
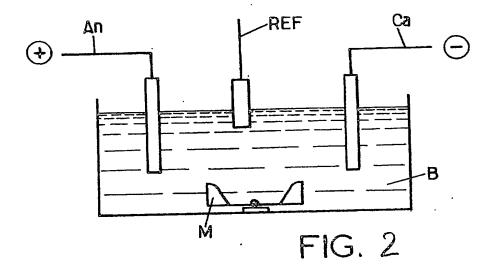


Fig. 1



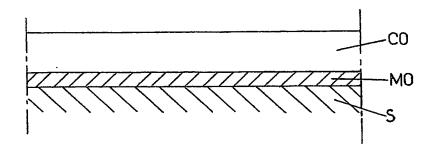


FIG.1.

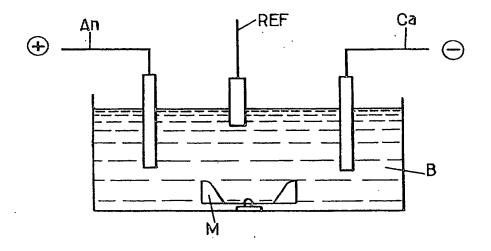


FIG.2.



BREVET D'IN NTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

ils, rue de Saint Peters 00 Paris Cedex 08 phone : 01 53 04 53 (04 Télécopie : 01 42 93 59 30	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 68 113 W /260899		
os références po	our ce dossier	AH/EMA-BFF020290		
acultatif)	EMENT NATIONAL	12/6 M2/		
	NTION (200 caractères ou e	nance maybrum		
	EGENERATION D'UN	BAIN D'ELECTROLYSE POUR LA FABRICATION D'UN COMPOSE 1-III-VI2 EN		
le (S) de man de Electricite	DE ERANCE, SERVICE	S NATIONAL		
		IR(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,		
DESIGNE(NT) i utilisez un forn	IN TANT QU'INVENTEU Iulaire identique et num	érotez chaque page en mulquant le nombre total de pages).		
Nom		TAUNIER		
Prénoms	<u></u>	Stéphane		
Adresse	Rue	2, RUE CROZATIER		
	Code postal et ville	75012 PARIS / FRANCE		
Société d'appart	enance (facultatif)			
Nom		GUIMARD		
		Denis		
Adresse		80a, RUE BOBILLOT		
	Code postal et ville	75013 PARIS / FRANCE		
Société d'appar	tenance (facultatif)			
Nom		LINCOT		
Prénoms		Daniel		
Adresse	Rue	46, RUE DES SOURCES		
	Code postal et ville	92160 ANTHONY / FRANCE		
Société d'appa	rtenance (facultatif)			
Le 26 DECE	WANDEUR(S) NATAIRE ité du signataire)	Standard .		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'IN NION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

00 Paris Cedex 08 ephone : 01 53 04 53	04 Télécopie : 01 42 93 59 30	Cet Imprimé est à rer	mplir lisiblement à l'encre noire	08 113 W /26059		
os références p facultatif)	our ce dossier	AH/EMA-BFF020290 /				
	REMENT NATIONAL	C	R16712			
TRE DE L'INVE	NTION (200 caractères ou	paces maidmum)				
PROCEDE DE I COUCHES MIN		SAIN D'ELECTROLYSE POUR L	A FABRICATION D'UN COMPO	SE 1-III-VI2 EN		
LE(S) DEMANDI	EUR(S) :					
ELECTRICITE CENTRE NAT	DE FRANCE, SERVICI IONAL DE LA RECHEF	NATIONAL CHE SCIENTIFIQUE - CNRS				
DESIGNE(NT) utilisez un forn	EN TANT QU'INVENTEI nulaire identique et nun	rotez chaque pagé en indiquant l	«Page N° 1/1» S'il y a plus de le nombre tòtal de pages).	trojs inventeurs,		
Nom		GUILLEMOLES		.3:		
Prénoms		Jean-François		``		
Adresse	Rue	80a, RUE BOBILLOT	80a, RUE BOBILLOT			
	Code postal et ville	75013 PARIS / FRAN	CE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Société d'appart	tenance (facultatif)					
Nom		GRAND				
Prénoms		Pierre-Philippe	Pierre-Philippe			
Adresse	Rue	9, RUE NOCARD				
	Code postal et ville	94220 CHARENTON I	LE PONT / FRANCE			
Société d'appar	tenance (facultatif)					
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'appartenance (facultatif)						
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le 26 DECEMBRE 2002 S. VERDURE (CPI n°97-0901)		Jana de la constante de la con	ed e			

PCT Application PCT/FR2003/003608